

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年10月5日(05.10.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/188999 A1

(51) 国際特許分類:
G01R 1/067 (2006.01) *G01R 31/28* (2006.01)
G01R 1/073 (2006.01)
(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/005990
(22) 国際出願日: 2023年2月20日(20.02.2023)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
PCT/JP2022/016805 2022年3月31日(31.03.2022) JP
(71) 出願人: 日本電子材料株式会社 (JAPAN
ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION)

[JP/JP]; 〒6600805 兵庫県尼崎市西長洲町 2
丁目 5 番 1 3 号 Hyogo (JP).

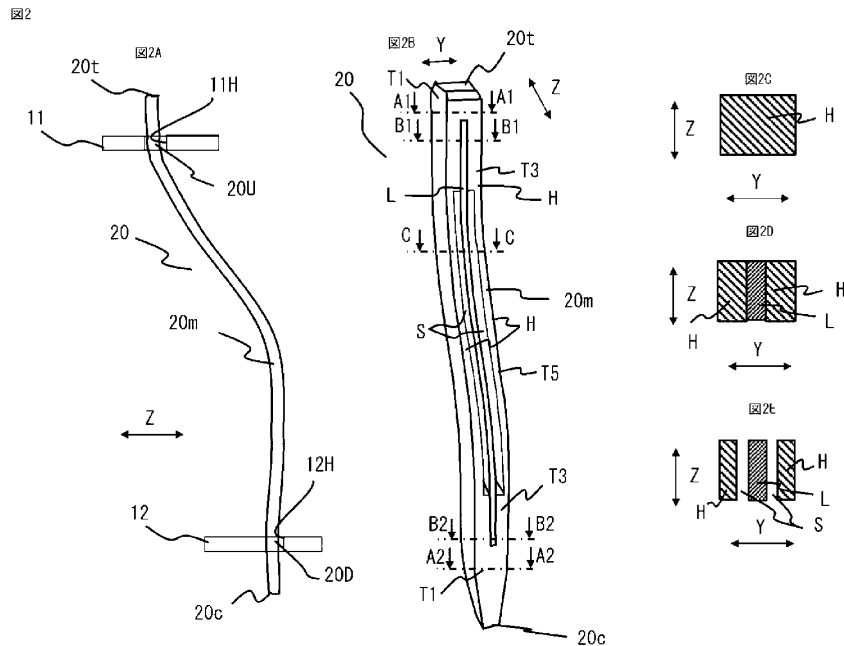
(72) 発明者: 大隈 江輝 (OKUMA Koki); 〒6600805
兵庫県尼崎市西長洲町 2 丁目 5 番 1 3 号 日
本電子材料株式会社内 Hyogo (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人ぱるも特許事務所 (PALMO
PATENT FIRM, P.C.); 〒6610033 兵庫県尼崎市
南武庫之荘 3 丁目 3 5 番 8 号 Hyogo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,

(54) Title: PROBE PIN AND PROBE CARD

(54) 発明の名称: プローブピンおよびプローブカード



(57) Abstract: This probe pin (20) is constituted from a low-resistance member (L) comprising an electroconductive first metal, and a high-resistance member (H) comprising an electroconductive second metal that has a resistivity lower than that of the low-resistance member (L). The probe pin (20) has, between a contact part (20c) and a terminal part (20t), a multiple layer part (T5, T505, T603) constituted in the order of the high-resistance member (H), a slit (S) that is a gap, and the low-resistance member (L), in a first direction (Y) different from a buckling direction in which the probe pin (20)

[続葉有]

KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

buckles during inspection of an object subject to inspection (W). The low-resistance member (L) and the high-resistance member (H) are disposed so as to not overlap when the multiple layer part (T5, T505, T603) is viewed from the buckling direction (Z).

(57) 要約: プローブピン (20) は、導電性を有する第1金属からなる低抵抗部材 (L) と、低抵抗部材 (L) よりも抵抗率の高い、導電性を有する第2金属からなる高抵抗部材 (H) によって構成され、コンタクト部 (20c) と端子部 (20t) との間に、検査対象 (W) の検査時におけるプローブピン (20) の座屈方向とは異なる第1方向 (Y) に、高抵抗部材 (H)、空隙であるスリット (S)、低抵抗部材 (L) の順に構成された複数層部 (T5, T505, T603) を有し、複数層部 (T5, T505, T603) を座屈方向 (Z) から見たときに、低抵抗部材 (L) と高抵抗部材 (H) とが重なり合わないよう配置されている。